

情 報 処 理

Vol. 30, No. 12 (1989 年 12 月)

目 次

巻 頭 言

論文誌の分冊村 井 真 一 1449

——特集:「VLSI のテスト容易化設計」——

- 特集「VLSI のテスト容易化設計」の編集にあたって.....藤 原 秀 雄 1450
1. VLSI のテスト容易化設計技術の研究動向.....樹 下 行 三 1451
2. テスト容易化設計法
- 2.1 PLA におけるテスト容易化設計法.....山 田 輝 彦 1461
- 2.2 メモリにおけるテスト容易化設計法玉 本 英 夫 1467
- 2.3 マイクロプロセッサにおけるテスト容易化設計古 屋 清 1473
3. テスト容易化設計技術の適用
- 3.1 テスト容易化設計技術の専用 VLSI への適用
.....岩 崎 一 彦・畠 山 一 実・宮 本 俊 介 1479
- 3.2 テスト容易化設計技術の汎用 VLSI への適用.....高 田 正 日 出・黒 部 恒 夫 1487

解 説

- 最大流アルゴリズムの最近の発展とその背景—I岩 野 和 生 1494
- グループウェア技術の研究動向石 井 裕 1502
- 最近の航空管制システム東 福 寺 則 保 1509

報 告

- パネル討論会「3次元対話環境の将来」
.....渡 辺 顯・松 井 俊 浩・廣 瀬 通 孝・神 部 勝 之・井 越 昌 紀 1517

論文誌梗概.....	1534
欧文誌アブストラクト.....	1538
書 評.....	1541
文 献 紹 介.....	1542
会 議 案 内.....	1547
雑 報.....	1548
日本学会会議だより.....	1549
著 者 紹 介.....	1551
研究会報告.....	1553
情報技術標準化のページ.....	1564
本 会 記 事.....	1565
総 目 次.....	巻末

会 告.....会告 (i ~xvii)